

Рис. 2. Дисперсия показателя преломления (*a*) и разность спектров (δ) образцов SiN_x, SiO_x, SiO_xN_y до и после УФ-воздействия

Fig. 2. Dispersion of the refractive index (*a*) and difference of the spectra (*b*) of SiN_x , SiO_x , SiO_xN_y samples before and after UV exposure